

**ВОЗДЕЙСТВИЕ МОЩНЫМ ИМПУЛЬСНЫМ ИОННЫМ ПУЧКОМ УГЛЕРОДА НА
ПРИПОВЕРХНОСТНЫЕ СЛОИ ЦИРКОНИЕВОЙ КЕРАМИКИ**

И.П. Васильев, С.А. Гынгазов, Т.С. Франгульян, А.В. Чернявский

Научный руководитель: профессор, д.ф.-м.н. А.П. Суржиков

Национальный исследовательский Томский политехнический университет,

Россия, г.Томск, пр. Ленина, 30, 634050

E-mail: zarkvon@tpu.ru

**ACTION OF POWERFUL PULSED CARBON ION BEAM ON SUBSURFACE LAYERS OF
ZIRCONIA CERAMICS**

I.P. Vasil'ev, S.A. Ghyngazov, T.S. Frangulyan, A.V. Chernyavskii

Scientific Supervisor: Prof., Dr. A.P. Surzhikov

Tomsk Polytechnic University, Russia, Tomsk, Lenin str., 30, 634050

E-mail: zarkvon@tpu.ru

The modifying effects of powerful pulsed beam (PPB) of accelerated carbon ions on subsurface layers zirconium ceramics composition (mol%) $97\text{ZrO}_2\text{-}3\text{Y}_2\text{O}_3$ were investigated. The ion beam had the following parameters: the energy of the accelerated ions is $E = 200 \text{ keV}$, current pulse duration equal $\tau_u = 100 \text{ ns}$, pulse current density $j_i = 40$ and 150 A/cm^2 . The total number of pulses was $N = 100$ and 300 . At current densities $j_i = 40$ and 150 A/cm^2 during the pulse $2,5 \cdot 10^{13}$ and $9,4 \cdot 10^{13} \text{ cm}^{-2}$ ions C^+ are implanted in the sample, respectively. The structural-phase state, elemental composition and mechanical properties of subsurface ceramic layers modified by ion beam were investigated. The size of the grains in the longitudinal direction on average 4 times larger than in the transverse direction. According X-ray diffractometry data the carbon ions implantation in the surface layer of ceramics is not accompanied by the formation of new impurity phases. When processing ceramics by ion PPB with $W_i = 3 \text{ J/cm}^2$ (fluence $f \geq 9,4 \cdot 10^{15} \text{ cm}^{-2}$) the formation of zirconia cubic phases up to 30 wt. % is observed. Based on analysis of the elemental composition irradiated surface layers by SIMS method and their electrical conductivity a conclusion was drawn that the main cause of the cubic phase stabilization in zirconia is the formation non-stoichiometric oxygen vacancies with high concentrations under ion treatment. It was found that action of ion beam on ceramics leads to a magnitude reduction of such mechanical characteristics as microhardness, nanohardness and Young's modulus.

В последние годы большой интерес вызывают методы поверхностной обработки, основанные на применении сильноточных импульсных пучков ускоренных ионов [1, 2]. Целью настоящей работы является установление эффектов модифицирования, вызванных действием мощного пучка ускоренных ионов углерода на приповерхностные слои циркониевой керамики.

Исследовалась циркониевая керамика состава (моль%) $97\text{ZrO}_2\text{-}3\text{Y}_2\text{O}_3$, спеченная из ультрадисперсных порошков, полученных плазмохимическим способом. Ионный пучок C^+ имел следующие параметры: энергия ускоренных ионов составляла $E=200 \text{ кэВ}$, длительность импульса тока $\tau_{\text{и}}=100 \text{ нс}$, плотность тока в импульсе $j_{\text{и}}=40$ и 150 А/см^2 . Скважность составляла 8 с. Указанным характеристикам соответствовала плотность энергии в импульсе $W_{\text{и}}=0,8$ и 3 Дж/см^2 . Обработка проводилась серией из 50 импульсов с

перерывом в 5 минут. Общее количество импульсов составляло $N=100$ и 300 . При плотностях тока $j_{и} = 40$ и 150 А/см^2 во время действия импульса в образец имплантируется $2,5 \cdot 10^{13}$ и $9,4 \cdot 10^{13}$ ионов углерода, соответственно.

Структурно-фазовое состояние приповерхностных слоев облученной керамики анализировали методами рентгенофазового анализа (РФА) и сканирующей электронной микроскопии (СЭМ). Их элементный состав изучали методом вторичной ионной масс-спектрометрии (ВИМС). Статическую электрическую проводимость модифицированных слоев измеряли в интервале температур $T=25-250 \text{ }^\circ\text{C}$ двухзондовым методом сопротивления растекания [3]. Механические характеристики керамики исследовали методами микро и наноиндентирования.

На основании проведенных исследований установлено, что обработка керамики мощным импульсным пучком ускоренных ионов C^+ приводит к оплавлению поверхностного слоя. Результаты микроскопических исследований поперечного сечения образца, приведенные на рис. 1, показывают, что зона проплавления составляет около 3 мкм. На некоторых участках этой зоны проявляется ее микроструктура. Видно, что по своей форме зерна в приповерхностной области и объема образца отличаются друг от друга. В приповерхностных слоях они вытянуты по направлению к поверхности. При этом размеры зерен в продольном и поперечном направлениях отличаются почти в 4 раза.

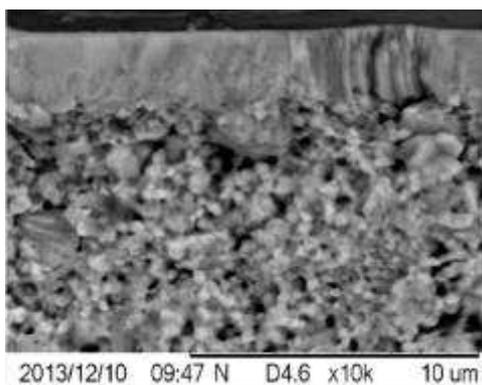


Рис. 1. Микрофотография поперечного излома циркониевой керамики после ионной обработки

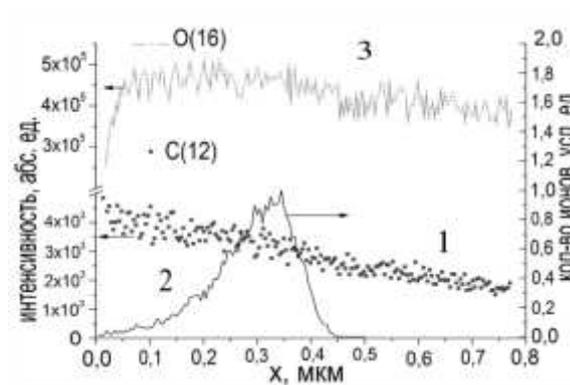


Рис. 2. Глубинные профили распределения ионов кислорода (кривая 3) и имплантированных ионов углерода (1 – эксперимент; 2 – расчет) в приповерхностных слоях керамики

На рис. 2. представлены измеренные методом ВИМС глубинные профили распределения имплантированных в образец ионов C^+ , а также собственных ионов кислорода в приповерхностном слое керамики. Концентрация имплантированных частиц плавно убывает по мере увеличения расстояния от поверхности. Данная зависимость отличается от рассчитанного по программе TRIM профиля, который имеет кривой с максимумом. Это несоответствие является результатом влияния диффузионных процессов на формирования профиля имплантированных частиц при облучении образцов МИП.

Из данных приведенных на рис 2 видно, что приповерхностные слои облученной керамики характеризуются дефицитом кислорода. Бомбардировка ускоренными ионами поверхности оксидного материала приводит к разрыву связи ионов кислорода с металлом и преимущественной десорбции кислорода при его низком парциальном давлении. Тем самым нарушается стехиометрия поверхностного слоя по кислороду. Согласно результатам РФА (табл.1) имплантация в приповерхностный слой керамики ионов углерода в количестве $3,1 \cdot 10^{19} - 3,6 \cdot 10^{20} \text{ см}^{-3}$ не сопровождалась образованием новых

примесных фаз. Однако из данных, приведенных в таблице видно, что при больших дозах облучения МИП наблюдается образование большого количества фазы диоксида циркония с кубическим упорядочиванием. Максимальное содержание кубической фазы в образцах имело место при флюенсе (f) ускоренных ионов $f = 2,8 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-2}$. Следует также отметить тот факт, что обработка керамики МИП вызывает существенное уменьшение размеров ОКР присутствующих в материале фаз. Причем размер ОКР фазы $c\text{-ZrO}_2$ составляет всего 15 нм. Таким образом, установлен факт образования в приповерхностном слое циркониевой керамики при ионном облучении наноразмерных частиц кубической фазы. Основная причина стабилизации кубической фазы в диоксиде циркония заключается в образовании при ионной обработке высокой концентрации нестехиометрических вакансий кислорода.

Таблица 1. Структурно-фазовые и механические характеристики приповерхностных слоев керамики до и после ионной обработки

Режим обработки	Фазовый состав, масс.%	L_t , нм	$(\Delta d/d)_t \cdot 10^3$	L_c , нм	$(\Delta d/d)_c \cdot 10^3$	H_v , ГПа	H_N , ГПа	E , ГПа
До обработки	100 t - ZrO_2	101	0,2	-	-	10,6	14,5	231
$W_{и}=0,8 \text{ Дж/см}^2, N=300$	100 t - ZrO_2	54	0,8	-	-	4,1	-	-
$W_{и}=3,0 \text{ Дж/см}^2, N=100$	(57 t+30 c) ZrO_2	34	1,4	15-20	2,3	6,1	9,8	157
$W_{и}=3,0 \text{ Дж/см}^2, N=300$	(79 t+21c) ZrO_2	33	1,3	-	-	5,1	-	-

Примечание: L_t, L_c - размер областей когерентного рассеяния (ОКР) рентгеновских лучей тетрагональной (t) и кубической (c) фаз, соответственно; $(\Delta d/d)_t, (\Delta d/d)_c \cdot 10^3$ -величина микроискажений t и c решетки ZrO_2 , соответственно; H_v, H_N, E - микротвердость, нанотвердость и модуль Юнга, соответственно.

Результаты, приведенные в таблице 1, свидетельствуют об изменении механических свойств приповерхностных слоев циркониевой керамики после ионной обработки. Облучение приводило к уменьшению значений микротвердости, нанотвердости, и модуля Юнга. Это указывает на увеличение пластичности модифицированного МИП слоя по сравнению с исходным его состоянием.

Авторы выражают благодарность профессору Ремневу Г.Е. за помощь в организации экспериментов по облучению образцов.

Работа выполнена в рамках НИР по Госзаданию «Наука»

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Овчинников В.В., Ремнев Г.Е., Гусельников В.И., Гуцина Н.В., Можаровский С.М., Филиппов А.В., Кайгородова Л.И. Иницируемые импульсными мощными ионными пучками изменения микроструктуры холоднодеформированного алюминий-литиевого сплава 1441 // Известия вузов. Порошковая металлургия и функциональные покрытия. – 2010. – № 2. – С. 32–38.
2. Surzhikov A. P. , Lysenko E. N. , Gyngazov S. A. , Franguljyan T. S. , Koval N. N. , Goncharenko I. M., Grigorjev S. V. Ion-plasma Treatment of Lithium-titanium Ferrites // ELEKTROTECHNICA & ELEKTRONICA. – 2012. – V. 47. – №. 5–6. – P. 201–204
3. Mazur R.G., Dickey D.H. A spreading resistance technique for resistivity measurement on silicon // Journal of The Electrochemical Society – 1966. – V. 113. – № 3. – P. 255–259